


名 称	低 真 空 走 査 型 電 子 顕 微 鏡									
概 要	<p>細く絞られた入射電子ビームを試料表面に走査させ、発生した電子を検出し、発生量を輝度の信号に変換すると目的の画像が得られます。2次電子は凹凸のうち凸部分の方が発生量が多いため、凸部分が明るく、凹部分が暗いものとなり、三次元的な凹凸をディスプレイや写真のような二次元の像として表すことができます。</p>									
特徴・諸元	<p>低真空SEM 機構／反射電子検出器を有し、生体や食品などの含水した試料や非導電性試料も無蒸着で観察可能で、かつ材料の原子番号の差を反映させた像を得ることも可能です。また、エネルギー分散型のX線分析装置と組み合わせることにより分析電子顕微鏡として微小部分の元素分析が可能です。</p> <p>得られたデータは、電子データとして保存が可能であるため、粒径分布や周辺長などの画像解析データとして利用可能です。</p> <p>◆ 主 要 諸 元</p> <table border="1" data-bbox="325 763 1445 1070"> <tr> <td data-bbox="325 763 592 831">〔分解能〕</td> <td data-bbox="592 763 1445 831">2次電子画像3.5nm、反射電子像6.0nm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="325 831 592 943">〔試料〕</td> <td data-bbox="592 831 1445 943">固体、粉末、生体・食品などの水分含有試料は低真空条件下で反射電子像として顕微観察可能</td> </tr> <tr> <td data-bbox="325 943 592 1010">〔試料形状〕</td> <td data-bbox="592 943 1445 1010">最大寸法50×50×50nm</td> </tr> <tr> <td data-bbox="325 1010 592 1070">〔分析元素〕</td> <td data-bbox="592 1010 1445 1070">B～U</td> </tr> </table>		〔分解能〕	2次電子画像3.5nm、反射電子像6.0nm	〔試料〕	固体、粉末、生体・食品などの水分含有試料は低真空条件下で反射電子像として顕微観察可能	〔試料形状〕	最大寸法50×50×50nm	〔分析元素〕	B～U
〔分解能〕	2次電子画像3.5nm、反射電子像6.0nm									
〔試料〕	固体、粉末、生体・食品などの水分含有試料は低真空条件下で反射電子像として顕微観察可能									
〔試料形状〕	最大寸法50×50×50nm									
〔分析元素〕	B～U									
										
担当部署	材料技術研究部 コンクリート材料									